AEC/APC Symposium Asia 2023プログラム

※プログラムは変更の可能性がございます

| 9-55 10-40 File | | | Chair | | Paper# | Title | Speaker | Affiliation | |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|--|
| Opening & Tutorial 1 Speech 日本 | 一橋記念講堂 | | | | | | | | |
| 9-50 9-50 平井 節前的 | 9:15 | 9:45 | | | | 受付開始 | | | |
| Post Post | Opening & Tutorial 1 Speech | | | | | | | | |
| 9.55 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 11-50 11- | 9:45 | 9:50 | | | | Opening Remarks from AEC/APC Asia | 西村 英孝 | ルネサスエレクトロニクス | |
| 19:55 10:40 Totorial COMUNE A TWO-RAMPS DE Session 1 | 9:50 | 9:55 | | | | プログラムアウトライン | 柿沼 英則 | キオクシア | |
| 11:00 11:00 田中 商人 東京エレアトロン 日中 商人 東京エレアトロン アプライトマチリアルス アプライトマリアルス アプライアス アプライス アプライアス アプリイアス アリイアス アリイアス アリイ | 9:55 | 10:40 | | | Tutorial-1 | <online>人工知能・機械学習による実践的な分子・材料・プロセスの設計およびプロセス管理</online> | 金子 弘昌 | 明治大学 | |
| 11:10 | | Session 1 | | | | | | | |
| 11:20 11:40 東京エノトロン アズレル DA-016 Pined-type Defect Pattern Classifications Takumi Maeda 策談大学 11:40 12:00 YM-009 報告生までドルボルと表現パターから表別パマンが表面する一般計 Seima Sakaguchi 三面大学 13:00 13:05 FRZ 会別 大イグシア Keynote Speech | 10:40 | 11:00 | | | GX-018 | Smart Subfab Transformation using Context-Based Control | Holland Smith | インフィコン | |
| 13:40 12:00 12:00 12:00 13 | 11:00 | 11:20 | 東京エレクトロン | | PTL-013 | Unified Platform for detecting faults governed by Process Controls | Vishali Ragam | アプライド マテリアルズ | |
| 13:00 13:40 | 11:20 | 11:40 | | | DA-016 | Mixed-type Defect Pattern Classifications | Takumi Maeda | 筑波大学 | |
| 13:00 13:45 14:05 | 11:40 | 12:00 | | | YM-009 | 画像生成モデルを用いた未知パターンの不良ウェハマップ分類に関する一検討 | Seima Sakaguchi | 三重大学 | |
| 13:00 13:45 株部 発則 | 12:00 | 13:00 | :00 展示・昼食 | | | | | | |
| 13:45 14:05 14:25 14:05 14:25 14:05 14:25 14:05 14:25 14:45 14:05 14:25 14:45 14:05 14:25 14:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 14:45 15:05 15:25 15:45 15:05 15:25 15:45 16:30 16:50 17:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 18:30 17:50 18:30 18 | Keynote Speech | | | | | | | | |
| 13:45 | 13:00 | 13:45 | | | Keynote | コンビューティングの未来 - ビット/ニューロン/キュービット - | 山道 新太郎 | 日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所 | |
| 14:05 14:25 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 15:05 15:25 15:45 | | | | | | | | | |
| 指令 等符 | 13:45 | 14:05 | ユナイテッド・セミコンダクター・ | タワー パートナーズ セミコンダク | PTL-007 | | Hyung Joo Lee | Siemens EDA | |
| 14:25 | 14:05 | 14:25 | | | PTL-019 | 低開口率エッチングの終点検出のためのRFモニタリング方法 | Chuhua Song | インフィコン | |
| 14:45 15:05 15:25 15:25 DA-012 パワートランジスタの特性はかつきの母集団推定と回路シミュレーションへの応用 Haruka Fukumoto ローム 15:05 15:25 DA-017 後工程における機械学書を用いた不良率予測 Yumiko Miyaji ソニーセミコンタクタマニコアク 15:25 15:45 | 14:25 | 14:45 | | | PTL-008 | | Chihiro Matsui | 東京大学 | |
| 15:25 15:45 16:30 三宅 賢治 | 14:45 | 15:05 | | | DA-012 | パワートランジスタの特性ばらつきの母集団推定と回路シミュレーションへの応用 | Haruka Fukumoto | Π−Δ | |
| 15:45 16:30 16:50 | 15:05 | 15:25 | | | DA-017 | 後工程における機械学習を用いた不良率予測 | Yumiko Miyaji | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | |
| 15:45 16:30 16:50 17:10 16:50 17:10 17:30 17:50 17:50 18:00 18:30 18:30 18:30 19:20 坂本 浩一 Tutorial-2 チップレット集積技術 東京工業大学 東京工業工学 東京工業工学 | 15:25 | 15:45 | | | | 展示・コーヒーブレイク | | | |
| 15:45 16:30 16:50 | Tutorial 2 Speech | | | | | | | | |
| 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 17:50 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 19:20 MEP-011 放降予知機能を搭載したインテリジェントモータバルブ MEP-011 放降予知機能を搭載したインテリジェントモータバルブ MEP-010 放降予知機能を搭載したインテリジェントモータバルブ MEP-010 Development of Versatile Fault Detection Using Image Sensors Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニグン DA-014 Anomaly detection of semiconductor manufacturing equipment by cluster analysis Yuki Shiga KOKUSAI ELECTRI PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニグン PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニグン PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニグン PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニグン PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura Natural Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura Natural Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura Natural Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder Takuya Sugiura Natural Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan United Spectroscopy Spectros | 15:45 | 16:30 | | | Tutorial-2 | チップレット集積技術 | 栗田 洋一郎 | 東京工業大学 | |
| 16:50 17:10 17:30 土山 洋史 インフィコン | | | | | | | | | |
| ### 20 19:20 | 16:30 | 16:50 | 土山 洋史 インフィコン | ソニーセミコンダクタマニュファク | DA-011 | 故障予知機能を搭載したインテリジェントモータバルブ | Hiroyuki Kawazato | 伸和コントロールズ | |
| 17:10 17:30 17:50 17:50 18:00 アニーセミコンダクタマニュファク チャリング PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Jaehyeon Kim Sungkyunkwan Uni Closing 会場移動 アーサーズインダビュー サ会議室 オーサーズインダビュー 原示・サーズインダビュー 原示・サーズインダビュー 原示・サーズインダビュー アー・フィング・フィング・フィング・フィング・フィング・フィング・フィング・フィング | 16:50 | 17:10 | | | MEP-010 | Development of Versatile Fault Detection Using Image Sensors | Takuya Sugiura | ルネサスエレクトロニクス | |
| 17:30 17:50 | 17:10 | 17:30 | | | DA-014 | Anomaly detection of semiconductor manufacturing equipment by cluster analysis | Yuki Shiga | KOKUSAI ELECTRIC | |
| 17:50 18:00 | 17:30 | 17:50 | | | PTL-015 | | Jaehyeon Kim | Sungkyunkwan Univ. | |
| 18:00 18:30 カーサーズインがユー 坂本 浩一 原示:Jet たみン | 17:50 | 18:00 | | | | | | | |
| 18·30 19·20 坂本 浩一 展示・レクブタン | 中会議室 | | | | | | | | |
| 18:30 19:70 Em. (77 F/a) | 18:00 | 18:30 | | | | オーサーズインタビュー | | | |
| | 18:30 | 19:20 | 坂本 浩一 東京エレクトロン | | | 展示・レセプション | | | |
| 19:20 19:30 Best Paper & Student Award | 19:20 | 19:30 | | | | Best Paper & Student Award | | | |